

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ЭНЕРГИИ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ВИДЫ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

FOCT 25678-83

Издание официальное

јена 3 коп.

МОСКВА (В ДОГО)

Редактор Л. А. Бурмистрова Технический редактор А. Г. Киницин Корректор Л. А. Новомарска

* .

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ЭНЕРГИИ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.

Виды. Основные параметры. Методы измерений основных параметров

ГОСТ 25678—83

Instruments for accasurement of pulse faser energy Types. Basic parameters. Methods for measurement of basic parameters

OKCTY 6343

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 марта 1983 г. № 1306 срок введения установлен

c 01.07.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на средства измерений (СИ) энергии однократных импульсов лазерного излучения и устанавливает их виды, основные параметры и методы измерений основных параметров при изменении параметров исследуемого излучения в пределах:

0,4-2; 10,6 мкм рабочие длины воли;

10-10- 500 Дж - диапазон значений энергии излучения:

10⁻⁹—1 с длительность импульса излучения.

Стандарт ве распространяется на измерительные импульеные лазеры.

1. виды

 Устанавливают следующие виды средств измерений эперали импульсного лазерного излучения:

тепловые измерительные преобразователи;

:измерительные приборы, основанные на тепловых и фотоэлектрических измерительных преобразователях

1.2. Тепловые измерительные преобразователи подразделяют на вилы в соответствии с ГОСТ 25312—82.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Основные параметры тепловых измерительных преобразователей, используемых при измерении энергии импульсного лазер-

пого излучения, - по ГОСТ 25312-82.

2.2. Для измерительных приборов, используемых при измерении энергии импульсного лазерного излучения, в качестве основных параметров устанавливают чувствительность, линейный динамический диапазон и основную относительную погрешность. Указанные параметры нормируют в технической документации на конкретные измерительные приборы.

3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

3.1. Измерительная аппаратура и вспомога-

тельное оборудование

3.1.1. Измерительная аппаратура и вспомогательное оборудование, используемые при измерения основных параметров тепловых измерительных преобразователей, — по ГОСТ 25312—82.

 При измеренни основных параметров измерительных приборов используют следующие измерительную аппаратуру и вспо-

могательное оборудование:

источник излучения на основе лазера или светоднода со значениями основных параметров, изменяющимися в пределах, находящихся внутри спектрального и динамического диапазонов иссле-

дуемого С11;

средство измерений энергии импульсного лазерного излучения, аттестованное или прошедшее поверку (далее — СИ с известными параметрами), основная погрешность которого меньше предполагаемой основной погрешности исследуемого СИ, работающее в динамическом и спектральном днапазонах исследуемого СИ;

набор нейтральных ослабителей, аттестованных на рабочих длинах волн с пределами изменений значений коэффициента пропускания т от 0,1 до 0,9. Основная погрешность ослабителя — не более

5%;

оптическую систему, состоящую из оптических элементов, предназначенных для фокусировки и деления пучка лазерного излучения.

3.2. Подготовка к измерениям

3.2.1. Измерения проводят при нормальных условиях, установленных в ГОСТ 24469—80.

 3.2.2. При проведении измерений следует руководствоваться требованиями безопасности, установленными в ГОСТ 24469—80.

 3.2.3. Перед проведением измерений должны быть выполнены следующие полготовительные работы; исследуемое и контрольное СИ и СИ с известными параметрами должны быть заземлены, установлены в рабочее положение, включены в сеть, прогреты при номинальном напряжении электропитания и выдержаны в нормальных условиях в течение времени, указанного в эксплуатационной документации. Все операции по подготовке к измерениям следует выполнять в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Госэнергонадзором.

Оптическая система должна быть отъюстирована таким образом, чтобы излучение попадало в центр оптических элементов, осуществляющих фокусировку и деление пучков излучения, и в центр приемных поверхностей СИ. Не допускается даже частичное попа

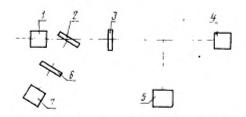
дание пучка на оправы входных окон СИ.

В помещении не должно быть конвекционных потоков (в том числе активной вентиляции), посторонних тепловых возмущений, внешних магнитных полей. Уровень запыленности не должен превышать 20 пыл/ч-см².

3.3. Определение чувствительности измерительных приборов на фиксированных длинах волн в диапазоне 0,4—2 мкм

Определяют чувствительность измерительных приборов на установке, схема которой приведена на чертеже, методом сравнения с аттестованным (поверенным) СИ в последозательности, приведенной ниже.

Блок-схема установки для определения чувствительности измерительных приборов



I — источник излучених: J — делительная навостина: J, δ — нейтральные ослабители, J — СИ с известными гараметрами J — исследуемое СИ. J — контрольное СИ

3.3.1. По показаниям СИ с известными параметрами устанавливают режим накачки источника излучения или подбирают коэффициент пропускания нейтрального ослабителя 3 таким образом, чтобы обеспечить работу СИ в таких условиях, чтобы энергия излучения, падающего на его чувствительный элемент, изменялась

в пределах, указанных в НГД на СИ конкретных видов. Коэффициент пропускания ослабителя 6 подбирают таким образом, чтобы обеспечить работу контрольного СИ в линейной области.

3.3.2. Определяют коэффициент деления делительной тины, для чего подают одиночный импульс лазерного излучения и снимают показання СИ с известными параметрами и контрольного СИ, соответствующие значениям энергии излучения, прошедшего черз делительную пластину W_i и отраженного от нее N_i .

3.3.3. Вычисляют результат единичного измерения коэффициен-

та деления К делительной пластины по формуле

$$K_i = \frac{N_i}{W_i}$$
, (1)

где N_i — i-е показание контрольного СИ; W_i — i-е значение энергии излучения, прошедшего через

лительную пластину

3,3.4. Проводят серию из л измерений К, (п>5) -ът, ктивидифесол эннэвенс вондвер тоявлярено и интерне энводу ления делительной пластины по формуле

$$K = \frac{1}{n} \sum_{l=1}^{n} K_{l}, \qquad (2)$$

где \overline{K}_{ℓ} — результат единичного измерения коэффициента деления.

3.3.5. Оценивают среднее квадратическое отклонение S (\overline{K}) ре зультата измерения коэффициента делезня делительной пластины в процентах по формуле

$$S(\overline{h}) = \frac{1}{K} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{R} (\overline{K} - K_i)^2}{n(n-1)}} \cdot 100.$$
 (3)

S(K) не должно превышать 1%.

3.3.6. Заменяют СИ с известными параметрами исследуемым СИ, регистрируют показания N_i контрольного СИ и показания N, исследуемого СИ и вычисляют значение чувствительности прибора А, для единичного наблюдения по формуле

$$A_i = \overline{K} \cdot \frac{N_j}{N_k}$$
. (4)

3.3.7. Проводят серию на п измерений А, (п≥5) на том уровне энергии, при котором был определен коэффициент деления делительной пластины К. Определяют среднее значение чувствительности измерительного прибора

$$\overline{A} := \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^{n} A_{k}. \tag{5}$$

Примечание. В необходимых случаях значения чувствительности приборов, основанных на тепловых преобразователях, измисляют с учетом поправки на температуру / в помещении, при которой лимолияют измерения

$$A_{ti} = A_{t}[1 + \alpha(t_{ii} - t)];$$
 (6)

$$A_{l} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} A_{li}, \qquad (7)$$

где A_t — результат единичного измерення чувствительности с попРавмой на температуру I;

I_н — нормальная температура, равная 20 °C;

гемпература в помещении;

 температурный коэффициент, определяемый эмпирическим путум указываемый в ИТД на СИ конкретных видов.

3.3.8. Оценивают среднее квадратическое отклонение $S(\overline{A})$ результата измерений чувствительности измерительного прибора в процентах по формуле

$$S(\overline{A}) = \frac{1}{\overline{A}} \int_{-1}^{1} \frac{\sum_{i=1}^{n} (\overline{A} - A_i)^2}{n(n-1)} \cdot 100.$$
 (8)

 З.4. Опредсление чувствительности измерительного прибора на длине волны 10,6 мкм

Чувствительность измерительных приборов на длине волны 10,6 мкм определяют на установке, схама которой приведсив на чертеже, при использовании в качестве источника излучения дазера непрерывного режима работы и при введении в эту схему дополнительного затвора, располагаемого перед делительной пластиной, в последовательности приведенной ниже.

3.4.1. Изменяя длительность импульса лазерного излучения затвором и мощность излучения лазера по показаниям СИ с известными параметрами, добиваются, чтобы энергия импульса излучения, падающего на чувствительный элемент СИ, изменялась в пределах, указанных в НТД на СИ конкретных видов.

3.4.2. Подавая с помощью затвора одиночные импульсы излучения, определяют K_ℓ , \overline{K} , A_ℓ , \overline{A} и $S(\overline{A})$ в соответствии с пп. 3.3.3—3.3.8.

3.5. Для каждой длины волны смещают центр входного окна СИ относительно центра сечения пучка на фиксированные расстояния вверх, вниз, влево, вправо, а также наменяя фиксированным образом угол между нормалью к плоскости входного окна СИ и осью пучка в пределах допускаемой расходимости дазерного излучения, для каждого нового положения СИ повторяют серию из л измерений (л > 5) и находят среднее значение чувствительности в соответствии с пл. 3.3.6 и 3.3.7. За исхомое значение чувствительности А принимают среднее арифметическое полученных средних значений Ā..

 3.6. Определение линейного динамического диапазона

Линейность СИ исследуют на установке, схема которой приведена на чертеже, в последовательности, приведенной ниже.

3.6.1. Проводят п одновременных измерений энергии импульсов излучения (п>5) исследуемым и контрольным СИ и вычисляют среднее значение отношения показаний СИ по формуле

$$K_{jep} = \sum_{n=1}^{n} \frac{N_i f N_n}{n}. \qquad (9)$$

где N_I - - отсчет по исследуемому СИ;

 N_{κ} — отсчет по контрольному СИ;

п — число измерений.

3.6.2. Устанавливают поочередно аттестованные ослабители с коэффициентом пропускания τ=0,7; 0,5; 0,3; 0,1, чтобы отсчеты по исследуемому СИ лежали поочередно в последней, третьей, второй и первой четвертях шкалы, и проводят при каждом ослабителе по п одновременных измерений (n≥5) исследуемым и контрольным СИ. Для каждой серии измерений находят среднее значение отношения показаний этих СИ по формуле (9).

 Коэффициент нелинейности исследуемого СИ или границу неисключенной систематической погрешности, обусловленную изменением чувствительности СИ в линейном динамическом диапазо-

не, $\Theta_{x.x}$ определяют в процентах по формуле

$$\Theta_{\text{A-A}} = \frac{\max(K_{\text{cp max}} - K_{f \text{cp}} f \epsilon_f)}{K_{\text{cp max}}} \cdot 100, \tag{10}$$

где $K_{\rm cp\ max}$ — значение коэффициента $K_{\rm f\ cp}$ при отсчетах, соответствующих крайнему верхнему значению диапазона измерений СИ:

измерений СИ; — отношение показаний исследуемого и контрольного СИ при коэффициенте пропускания ослабителя τ_j

в данной серин измерений.

Показание исследуемого СИ принимают равным верхнему пределу линейного динамического диапазона, если коэффициент нелинейности $\Theta_{A,A}$ равен, но не превышает значения, указанного в НТД на СИ конкретных видов, и принимают равным нижнему пределу линейного динамического диапазона, если $\Theta_{A,A}$ равен, но не меньше соответствующего значения, указанного в НТД.

Определение основной погрешности
 Основную относительную погрешность определяют по формуле

$$\Delta - K \sqrt{\sum_{i=1}^{n} S_{i}^{2} + \frac{1}{3} \sum_{j=1}^{m} \Theta_{j}^{2}}$$
 (11)

- где K коэффициент, зависящий от соотношения случайной и неисключенной систематической погрешностей, от принятой доверительной вероятности и определяемый по ГОСТ 8.207—76;
 - S_I оценка суммарного квадратического отклонения, характеризующая i-ю случайную погрешность;

 $\sum_{i=1}^{n} S_{i}^{2}$ - - определяют по формуле

$$\sum_{k=1}^{n} S_{k}^{2} \cdots S_{1}^{2} + S_{2}^{2}, \qquad (12)$$

- где S. оценка среднего квадратического отклонения случайной погрешности СИ с известными параметрами, указанная в паспорте или свидетельстве о метрологической аттестации, %;
 - S₂ оценка среднего квадратического отклонения результата измерений среднего значения чувствительности, вычисленная по формуле (8), %;
 - граница ј-й составляющей неисключенной систематической погрещности;

$$\sum_{j=1}^{\infty} \Theta_{j}^{2}$$
 — определяют по формуле

$$\sum_{j=1}^{m} \Theta_{j}^{2} = \Theta_{1}^{2} + \Theta_{2}^{2} + \Theta_{3}^{2} + \Theta_{2}^{2} . \tag{13}$$

- где ⊖₁ неисключенная систематическая погрешность СИ с известными параметрами, указанная в паспорте или свидетельстве о метрологической аттестации, %;
 - Θ₂ неисключенная систематическая погрешность, обусловленная зависимостью чувствительности измерительного прибора от угла в пределах допускаемой расходимости лазерного излучения и места падения пучка излучения на входное окно СИ, %;
- Θ_{3...} неисключенная систематическая погрешность, обусловленная изменением чувствительности СИ в линейном динамическом диапазоне, определяемая в процентах в соответствии с п. 3.6.3;
 - Өт праница составляющих неисключенной систематической погрешности, влияющих на изменение чувствительности (например, обусловленных изменением длительности и формы импульсов излучения, спектрального состава излучения, температуры, напряжения питания в пределах нормальных условий и т. п.), %.

Значения Θ_2 и Θ_Σ вычисляют по формулам

$$\Theta_{2(\Sigma)}^{2} = \sum_{i=1}^{n} \Theta_{2(\Sigma i)}^{2}; \quad \Theta_{2(\Sigma i)} = \frac{\overline{A} - A_{2(\Sigma i)}}{\overline{A}},$$
 (14)

Cup. 8 FOCT 25678-83

где п — число результатов измерений;

А среднее значение чувствительности (см. п. 3.3.7);

А_{Σ1} значение чувствительности, определяемое в соответствии с п. 3.3.6 при максимально допускаемом изменении одного из влияющих на Θ₂ и Θ_Σ параметров.

Вид и число составляющих Θ_{Σ} устанавливают в зависимости от свойств использованных материалов, конструкций и условий применения исследуемого СИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ измерений чувствительности измерительного прибора

Таблица 1

Результаты измерений		Номер				
	1	2	3	4	5	Среднее значение
1. Показание контрольного СИ N I						
2. Значение энергии излучения W_I						
3. Коэффициент деления дели- тельной пластины $K_t = N_t/W_t$						$\overline{K} = \frac{1}{5} \sum_{t=1}^{5} K_t$
4. Оценка с к. о. результата измерений K для $n=5$ $S(\overline{K}) = \frac{1}{K} \sqrt{\frac{\frac{5}{\Sigma} (\overline{K} - K_i)^2}{20}} \times \times 100\%$						
5. Показание исследуемого СИ N _J						
6. Соответствующее показание контрольного СИ						
7. Чувствительность исследуе- мого СН $A_i = \overline{K} \cdot N_J / N_i$						$\overline{A} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^{5} A_i$
8. Опенка с. к. о. результата взмерения А для n=5						
$S(\bar{A}) = \frac{1}{\bar{A}} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5} (\bar{A} - A_i)^2}{20}} \times$						
×100%	- 1			-		

CTP. 10 FOCT 25678-83

Примечания:

 Табл. 1 приведена для случая попадания пучка излучения в центр приемной поверхности СИ.

 Для случаев смещения центра сечения пучка излучения и центра приемной поверхности СИ друг относительно друга на фиксированные расстояния вверх, вина, вачею, вправо соответственно составляют протоколы измерений по форме, зналогичной табл. 1. При этом и наименованиях таблии следует указинать положение центра приемной поверхности СИ относительно центра сечения пучка излучения.

3. Для случаев смещения оси, проходящей через нентр приемной поверхности и перпендякулярной к ней, относительно оси пучка излучения да фиксированные углы вверх и вниз в вертикальной в горизонтальной плоскостях соответст венно составляют протокоды измерский по форме, аналогичной табл. 1. При этом в наименованиях таблиц следует указывать положение указанных осей друг относительно друга.

ПРОТОКОЛ измерений линейного динамического диапазона СИ

Табляца 2

Результаты: из м ерский						
	I.	2	3	4	5	Среднее значение
Показанне всследуемого СИ						
Показание ноитродьного СИ $N_{\rm A}$						
Отнощение значений $N_i/N_{\rm K}$						$K_{\rm cp} = \frac{1}{5} \sum_{I,\kappa}^{5}$

Примечание. Повторить для каждого из следующих значений коэффициентов пропускания ослабителей: $\tau_f = 0.1$; 0.3; 0.5; 0.7 и для каждого τ_f находится $K_{\rm JCP}$, а коэффициент нелинейности СИ или границу неисключеной систематической погрешности, обусловленную измененнем мувствительности СИ в линейном динамическом диапазоне, $\Theta_{3.3}$ определяют в процентах по формуле

$$\theta_{\text{g.x}} = \frac{\max (K_{\text{cp max}} - K_{\text{jcp}}/\tau_I)}{K_{\text{cp max}}} \cdot 100 .$$